

V2019
VAKUUM & PLASMA

EFDS 



Die V im
Zentrum!

8./10. OKTOBER 2019

INTERNAT. CONGRESS CENTER DRESDEN

Messtechnik auf der V2019

Di., 08.10.2019 bis Do., 10.10.2019

Im Bereich der Dünnschichttechnologie ist die Nutzung von Messtechnik in allen Anwendungsbereichen erforderlich. Ob zur Charakterisierung der veredelten Oberflächen, zur Qualitätskontrolle des Produktes oder zur Prozesskontrolle, in allen Workshops wird das Thema Oberflächenanalytik eine Rolle spielen.

Programm zum Schwerpunkt Messtechnik

Dienstag, 08.10.2019

11:30 – 12:00 Uhr | WS1 - V01 | Saal 4

„Prozesscharakterisierung und Prozesskontrolle in Vakuumbeschichtungsanlagen“

Thomas Schütte, Plasus GmbH, Mering

13:00 – 17:30 Uhr | Industrierausstellung

Zahlreiche Aussteller, wie u.a. SENTECH Gesellschaft für Sensorik mbH, SURAGUS GmbH, Anton Paar Germany GmbH, Zwick Roell GmbH & Co. KG oder Reuter Technologie GmbH, stellen Ihre Produkte zum Thema vor.

17:30 – 18:00 Uhr | WS1 – V10 | Saal 4

„Optische Online Inspektion“

Hans Örley, Dr. Schenk GmbH, Planegg

Mittwoch, 09.10.2019

11:30 – 12:00 Uhr | WS2 – V11 | Saal 3

„Biologische Materialtestung 2.0 – Standardisiertes Verfahren zur biologischen und mikrobiologischen Beurteilung solider Materialien am Beispiel von plasmabeschichteten Oberflächen“

Juliane Spohn, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Leipzig

12:00 – 12:30 Uhr | WS2 – V12 | Saal 3

„Mikro- und nanomechanische Analyse von Biomaterialien“

Holger Großmann, Anton Paar Germany GmbH, Ostfildern

12:30 – 13:30 Uhr Mittagspause inkl. Fachkräfte Scouting

13:30 – 14:00 Uhr | WS3 – V01 | Saal 5

“Take a quick look - real-time optical characterization of materials and thin films”

Wolfgang Theiss, WTheiss Hardware and Software, Aachen

14:00 – 14:30 Uhr | WS3 – V02 | Saal 5

„Eine Qualitätskontrolle von optischen Beschichtungen für Photonik 4.0“

Lars Jensen, Laser Zentrum Hannover e.V., Hannover

V2019
VAKUUM & PLASMA

EFDS 



Die V im
Zentrum!

8./10. OKTOBER 2019

INTERNAT. CONGRESS CENTER DRESDEN

14:30 – 15:00 Uhr | WS3 – V03 | Saal 5

„Streulicht- und Rauheitsanalyse als Werkzeug zur Optimierung multifunktionaler Oberflächen“

Sven Schröder, Fraunhofer IOF, Jena

15:00 – 16:00 Uhr Kaffeepause inkl. Fachkräfte Scouting & Postervorstellung

16:00 – 16:30 Uhr | WS3 – V04 | Saal 5

"Exotische Lebensdaueranforderungen an Dünnschichtbauelemente und deren Qualifikation"

Christian Franke, H. Bernitzki, S. Laux, Jenoptik Optical Systems GmbH, Jena

Donnerstag, 10.10.2019

9:00 – 9:30 Uhr | WS5 – V04 | Saal 3

“Advances in quantitative characterization of thin films with help of AFM-based methods”

Malgorzata Kopycinska-Müller, Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS, Dresden

9:30 – 10:00 Uhr | WS5 – V05 | Saal 3

„In situ metrology for Atomic Layer Deposition processes“

Martin Knaut, Technische Universität Dresden, IHM, Dresden

10:00 – 10:30 Uhr | WS5 – V06 | Saal 3

„Conformality in Atomic Layer Deposition“

Véronique Cremers, Plasma Electronic GmbH, Neuenburg, Germany

10:30 – 11:00 Uhr Kaffeepause

11:00 – 11:30 Uhr | WS4 – V12 | Saal 5

„Erweiterung des Einsatzpotenzials PVD-beschichteter Vergütungsstähle für Anwendungen in korrosiven Umgebungen“

Holger Hoche, Institut für Werkstoffkunde, TU Darmstadt, Darmstadt

11:30 – 12:00 Uhr | WS4 – V13 | Saal 5

„Ionenstrahlgestützte Präparationstechniken und hochauflösende Elektronenmikroskopie für die produktbegleitende Schichtentwicklung und Schadensanalytik“

Jörg Kaspar, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS, Dresden

12:00 – 12:30 Uhr | WS4 – V14 | Saal 5

„Mechanische, topometrische und optische Charakterisierung von Oberflächen und Schichten unter Berücksichtigung normativer Aspekte“

Uwe Beck, Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM, Berlin

Änderungen vorbehalten!